

**要 旨** 小角・広角X線散乱と示差走査熱量測定との同時測定,あるいは偏光解消光散乱同時測定により,高分子ナノ 構造の形成過程の詳細な解析を行った事例を解説する。前者の同時測定では,結晶性高分子材料が結晶化する発熱過程を 同時に追跡することに意義があり,後者では,結晶性高分子材料が球晶を形成するプロセスを同時に追跡することに意義 がある。昨今,結晶性高分子材料の研究は,最も単純な系であるホモポリマーに留まらず,ポリマーブレンドやブロック コポリマーに対象が拡張され,より階層性の高い高次構造の形成過程に興味が持たれている。同時測定という手法がこれ らの階層的高次構造の形成過程の解明に有効であり,高輝度である放射光のメリットが最大限活用されている状況を紹介 する。

# 1. はじめに

X線散乱は物質のミクロスコピックな構造を解析する ための最も有力な手法の一つであり、非破壊かつ高い信頼 度で構造解析を行うことができる。しかしながら、X線 散乱法だけでは十分とは言えない場合が多々あり、他の構 造解析手法と併用され多面的に情報収集することが必要で ある。X線散乱法以外の手法としては、たとえば、高分 子の結晶化を観察する方法として、赤外吸収(IR)法, ラマン分光法,核磁気共鳴(NMR)法,電子スピン共鳴 法(ESR)法, 偏光解消光散乱(Hv-SALS)法, 偏光顕 微鏡観察や示差走 査熱量分析 (DSC) 法など様々な方法 が挙げられる。IR 法やラマン分光法では、結晶化にとも ない特定の波数領域に吸収バンドが出現する。また、結晶 化の前駆段階で高分子鎖のコンホメーション(高分子鎖の 空間的広がりの形態)が局所的にどのように変化していく かも解析可能である。一方, NMR 法や ESR 法では, 核 スピンや電子スピンをとりまく環境が結晶化にともない変 化するため、信号として捉えることができる。それら異な る手法による測定を別々に行ってデータ収集を行う場合に 問題となるのは、得られたデータの比較において、厳密な 時間的一致が見られないことが往々にしてあることであ る。それは、試料の個体差、温度制御の不正確さや分布な どの実験条件の不一致に起因することが多い。それによ り、別手法による実験結果の差異が本質的に重要な結論で あるのか否か、判断できないことが多い。階層性構造の構 築過程を正確に解明し理解するために、異なる手法を組み 合わせた「同時測定」1-9)を行うのが最も効果的である。同

時測定の組み合わせも次々と考案され,進歩している。し かし,同時測定といえども,検出器の感度に関わる問題が 残るため,論議は絶えない。微弱な信号(散乱 X 線)を どの程度敏感にカウントすることができるか,という装置 上の問題に加え,信号を検出するための最低限必要な状態 変化の規模(検出限界)も重要な問題である。また,各測 定手法がいかなる状態変化を検知するかを明確にする必要 もある。例えば広角 X 線散乱(WAXS)の場合,密度ゆ らぎを敏感に捉えそれを信号変化として検出できるのか, あるいは原子の規則的配列(結晶格子)が必須なのか,と いう問題である。

本稿では、このような問題もふまえ、高エネルギー加速 器研究機構(KEK)の放射光研究施設(PF)BL-9C<sup>10</sup>)に 設置された小角/広角X線散乱(SAXS/WAXS)同時測 定装置に、さらにDSCを組み合わせた同時測定法による 研究成果、おもに高分子の結晶化について紹介する<sup>7,8)</sup>。 また、Hv-SALSを組み合わせた同時測定法(SAXS/ WAXS/Hv-SALS)についても紹介する<sup>9)</sup>。この手法は特 に、結晶性ポリマーが自発的に形成する階層構造を解析す るために非常に有効である。

## 2. 結晶性高分子の階層構造

同時測定法の意義を解説するために,まず,階層構造に ついて説明する。Fig.1の模式図に示すように,高分子鎖 は通常,規則的に折りたたまって厚みが均一な結晶ラメラ (板状晶とも呼ばれ,通常数ナノメートル程度の厚みであ る)を形成し,さらにそれが放射状に成長し,球晶とな



Fig. 1 Hierarchical structures spontaneously formed in crystalline polymers. (文献32より引用)

る。球晶は、大きいもので、数10 µm におよぶこともあ る。したがって、球晶構造は、材料の光学的性質(例えば 透明性)や力学的性質(球晶が大きくなるとひび割れが生 じやすく脆くなるなど)に多大な影響を及ぼす。このよう な観点から、球晶構造の制御は実用上重要である。球晶は Fig.1に示してあるように、最上位の階層に位置する構造 であるので、下位の全ての構造、すなわち、1Åから数10 µm にわたる構造の階層性がどのように構築されるかを正 確に理解しなければならない。これは、前述の実用的観点 のみならず、学術的にも非常に興味深い問題である。

構造に階層が存在するという特徴は高分子以外の非生物 系ではほとんど見られない(液晶は例外)ことであり,各 階層構造に起因する物性が共存しているという高分子材料 の優れた特徴を生み出す。各階層に異なる情報を記憶させ ることができれば,情報の縮約化や階層化を図ることがで きるし,それぞれの構造に異なる機能を持たせば機能の複 合化を実現できる。このように,結晶性ポリマーが自発的 に形成する階層構造は,未知の可能性を秘めている。

ー本の高分子鎖は主鎖に平行な方向と垂直な方向で屈折 率が異なる(復屈折)ため、それが規則的に折りたたまっ てできている結晶ラメラは光学異方性を有する。このた め、結晶ラメラからなる高次構造(球晶)の解析は偏光を 利用して、例えば偏光顕微鏡やHv-SALS法によって行 うことができる。Hv-SALS法では、試料をはさんで偏光 子(ポーラライザー)と検光子(アナライザー)の偏光方 向を直交させた状態で散乱光強度の2次元パターンを測 定する。Hv-SALS法では、屈折率のゆらぎを捉えること ができるので、結晶化の初期段階でポリマー鎖の配向ゆら ぎを検出することも可能で、その意味でも重要な手法であ る。

各階層における構造変化を追跡することによって、相転

移にともない階層的高次構造がどのように構築されるかを 明らかにすることが、同時測定の最大の目的である。 WAXS と DSC では最も下位の構造, すなわち結晶単位格 子の形成過程を, SAXS では中位の階層に位置する結晶 ラメラの構造あるいはその繰り返し構造の形成過程を、ま た Hv-SALS により最上位の階層構造である球晶の形成 過程を、それぞれ明らかにすることができる。高分子の結 晶化過程は、結晶化させる温度が融点に近付くほど速くな る。したがって、迅速に精度のよいデータを短時間で取得 する必要があり、放射光を用いることによって、このよう な速い過程が追跡できるようになって、これまでよくわか らなかった過程が明らかにされつつある。特に、誘導期に おける結晶化の前駆過程の研究が活発になされてきた。こ のように、高分子研究において、相転移にともなう構造形 成過程あるいは構造再編過程を解明するために、放射光は 多大な貢献を果たしている。

### 3. 小角/広角 X 線散乱同時測定装置

汎用のX線発生装置に比べて放射光は高輝度であり, またノイズも少ないというメリットがある。薄膜や微量試 料の測定ならびに早い時分割測定を実施するために、放射 光は必須である。それのみならず、以下のような理由で、 放射光は同時測定を行うために必要不可欠である。まず, DSC との同時測定について述べる。DSC 測定用の試料セ ルはX線を吸収し、散乱強度が著しく減衰するため、 DSC との同時測定を行うためには、強い線源が必要とな る。また、光散乱との同時測定については、試料の厚みの 問題がある。すなわち、多重散乱しないようにしなければ ならないため、光散乱用の試料をあまり分厚くすることが できない。試料厚みは数10~数100 µm が適切であるが, その一方で、X線散乱用の試料厚みは1~3mm が最適で ある。したがって,光散乱用に試料を薄くしてしまうと, 通常のX線源では散乱強度が弱すぎて統計精度のよい データを得るためには測定時間を長くしなければならな い。これは時分割測定にとっては致命的な弊害である。線 源強度の強い放射光を用いれば、薄い試料についても十分 な散乱強度が確保できるので、放射光を使うメリットは計 り知れない。放射光なくしては、光散乱との同時測定は不 可能である。

**Fig. 2**に示すのは, BL-9C に設置された SAXS/WAXS 同時測定装置である。通常 X 線の波長( $\lambda$ )を0.15 nm に 設定しており,この波長を使用した場合,PSPC を用いた 測定で,qレンジ(qは散乱ベクトルの大きさでありq= ( $4\pi/\lambda$ )sin( $\theta/2$ )と定義され、 $\theta$ は散乱角である)は小角 領域で約0.09~3.0 nm<sup>-1</sup>( $4 \times - \psi \times f$ プレート(IP)使 用時は最大でq=5.0 nm<sup>-1</sup>程度まで可能),広角領域で約 12~21 nm<sup>-1</sup>( $\lambda$ =0.154 nm で $\theta$ は16.9~29.8°に対応する) をカバーする。検出器を設置するポジションを変えること



**Fig. 2** Apparatus for simultaneous SAXS/WAXS measurement settled at BL–9C beamline in KEK–PF (Tsukuba, Japan).

によって測定範囲はわずかに変更可能である。IP を用い たWAXSの実験では,カメラ長にして約10 cm の位置に IP を設置することでかなり広角領域まで測定可能であ る。もちろん IP 測定では早い時分割同時測定は不可能で ある。サンプル周辺はユーザーによってアレンジでき,リ ンカムホットステージ,DSC セル,圧力装置,ヒーター ブロック,試料延伸機などその他の測定を組み合わせるこ とが可能である。

小角および広角 PSPC のデータは、Laboratory Equipment Corporation 社製マルチチャンネルアナライザー (2100C/MCA)装置 2 台を USB 接続により、また、その 他の外部信号(入射 X 線強度)は GPIB 接続(最大 6 台 まで接続可能)により同時取得される。DSC からの情報 は X 線散乱データ収集システムとは独立に収集しており、 X 線散乱測定と DSC 測定の完全な同期はとれていない。 現状のシステムでは、その差は数秒以内である。

# 4. 結晶性ブロック共重合体の結晶化過程を 追跡するための SAXS/WAXS/DSC 同時 測定

時分割X線散乱とDSC を組み合わせた測定<sup>11-13</sup>,ある いはX線散乱とDSCの同時測定<sup>7,8,14-18)</sup>は高分子や液晶系 の相転移挙動の機構解明に非常に役立つものとして利用さ れている。我々は,結晶性高分子と非晶性高分子から成る ブロック共重合体の結晶化挙動をSAXS/WAXS/DSC 同 時測定によって追跡した。このような結晶性ブロック共重 合体における結晶化過程では,結晶化とミクロ相分離が競 合している。ここで用いた試料はポリエチレン(PE)-b-ポリエチレンプロピレン(PEP)ジブロック共重合体で あり,PE が結晶性高分子である。溶融状態からPEの融 点より僅かに低い温度に急冷してからの構造形成について 検討した。試料はアニオン重合法により,まず PE-b-PEP の前駆体であるポリブタジエン-ポリイソプレンジブ ロック共重合体を合成し,これを水素添加することによっ て得られたものである。前駆体高分子の数平均分子量  $M_n$ は44,200,分子量分布(重量平均分子量と数平均分子量の 比, $M_w/M_n$ )は1.05であり,PEの重量組成は52 wt%で あった。DSC より求めた PE の融点は108℃であった。中 央に直径 3 mm 程度の穴の開いたアルミパン(厚み0.5 mm)に粉末試料を溶融状態にして詰め,両面をカプトン フィルム(厚み12  $\mu$ m)でシールした。等温結晶化実験で は試料を 2-20℃/min で180℃まで昇温し 3 分間保持した 後,結晶化温度まで20℃/min で急冷した。

結果と考察に移る。**Fig.3**に示すのは試料の溶融状態 (118℃)と融点以下の結晶(固体)状態(90℃)での SAXSプロフィール(SAXS散乱強度*I*(*q*)に散乱ベクト ル*q*の2乗をかけてローレンツ補正<sup>19)</sup>したもの[*q*<sup>2</sup>*I*(*q*)] を*q*に対してプロットしてある)である。融点以下では4 つのピークが観測され,ピークを与える散乱ベクトル*q*の 値の相対比は1:2:3:4であることから,ラメラ状のミ クロ相分離構造を形成していることがわかる。一方,溶融 状態ではピークが全く観測されなかった。両ポリマー間に 充分な電子密度差があれば構造のない無秩序状態でも correlation hole によるピークが観察される<sup>20)</sup>。溶融状態にお いてピークが観測されないのは電子密度差が小さいためで あろう。確認のため,別途,粘弾性測定を行ったところ 105±5℃以上では無秩序状態であることがわかった。

**Fig. 3**の固体状態のプロフィールから散乱密度相関関数 を次式により求めた<sup>19)</sup>。

$$\gamma(r) = \frac{\int_0^\infty I(q) q^2 \cos(qr) dq}{\int_0^\infty I(q) q^2 dq}$$
(1)

**Fig. 4**に示すように,  $\gamma(r) \circ r \to 0$  での立ち上がりを直線 近似して, これと $\gamma(r)$  の極小値(図中に示す-B'の値) を通る水平な直線との交点から系の最小ドメインサイズを 求めることができる。さらに $\gamma(r)$  の極大を与えるrの値 からドメイン周期( $d_s$ ) がわかる。この系では最小ドメイ ンサイズは結晶の厚み $d_c$ に相等し, 4.8 nm と求まった。 また, このブロック共重合体試料の PE 組成は52 wt% ( $\nu_{PE}$ =48 vol%) であるので, **Fig. 4** の挿入模式図中の $d_{PE}$ = 16.9 nm となる。したがって, PE ドメイン中での結晶 化度  $X_c$ は4.8/16.9=28 vol%(31 wt%)と求まる。また, 図中の  $Q' \ge B'$ も  $X_c$ 算出に用いることができる<sup>19)</sup>。Q'は 小角散乱の不変量(インバリアント)であり,  $Q' \sim \Delta \rho^2$  $X_c$ (1- $X_c$ ) である。一方 B'は $\Delta \rho^2 X_c^2$ に比例する量であ る。ここで,  $\Delta \rho$ は2 相の電子密度差である。PE  $\ge$  PEP のアモルファスは,電子密度がほぼ等しいので,  $\Delta \rho$ はア



Fig. 3 SAXS intensity profiles from PE-PEP (top profile at 90°C, bottom profile at 118°C).



**Fig. 4** One-dimensional electron density correlation function calculated from the SAXS profile.

モルファス相と結晶相の電子密度差に対応する。 $X_{\rm C}=B'/(B'+Q')\nu_{\rm PE}$ より求めた $X_{\rm C}$ は29 vol%(32 wt%)となった。この試料の DSC 測定を別途行い,結晶化度を求めたところ24 wt%であることがわかり,SAXS 結果とよい一致を示した。

次に等温結晶化実験の結果を示す。等温結晶化実験で は、サンプルの溶融状態(180℃)から結晶化温度まで一 気に急冷して、その後の結晶化過程の追跡を行った。溶融 状態では前述したとおり無秩序状態であり、結晶化に伴い ミクロ相分離が誘起される。Fig.5は、100℃の等温結晶 化において時分割 SAXS/WAXS/DSC 同時測定で得られ



Fig. 5 Temporal changes in SAXS (middle) and WAXS (right) profiles, along with DSC thermogram. SAXS, WAXS, and DSC data were obtained simultaneously during isothermal crystallization at 100°C.

た典型的な結果である。また SAXS 及び WAXS の結晶化 最終プロフィールも載せた。これらの結果から,結晶化初 期過程でまず最初に DSC の発熱が観察され,ついで SAXS にピークが出現するとともに,ほぼ同時に WAXS にも PE 結晶(斜方晶)の(110)及び(200)の反射ピーク が現れ始めた。さらに詳細に議論するため,SAXS/ WAXS/DSC 同時測定の結果に基づき,結晶化度を計算し た。まず SAXS の結果から散乱の不変量 Q'を次式に従っ て求める。

$$Q' = k \int_{0}^{\infty} I(q) q^{2} dq = k \Delta \rho^{2} X_{\rm C} (1 - X_{\rm C})$$
(2)

Q'の値から体積結晶化度  $X_{\rm C}$  を求めるためには、上式の右 辺に示した関係を用いればいいのであるが、そのために は、電子密度差  $\Delta \rho$  と比例係数 k を知る必要がある。前述 のように  $\Delta \rho$  は結晶相とアモルファス相の電子密度の差と 見なすと、計算により算出可能である。一方、比例係数 kについては、結晶化過程の最終段階で得られた Q'の値 (SAXS プロフィールから計算)と、最終の体積結晶化度 の値から算出できる。それらの値を(2)式に代入すること によって k を求めた。以上のようにして算出した  $\Delta \rho$  と kを用い、等温結晶化過程における SAXS のインバリアン ト Q'の時間変化から、結晶化度  $X_{\rm C}$ の時間変化を求め た。最終の結晶化度の値 ( $X_{\rm C,\infty}$ )で規格化したデータを Fig. 6 にプロットした (Fig. 6 の  $\bullet$ )。次に、WAXS データ から厳密に結晶化度を評価するかわりに、ここでは簡易的



Fig. 6 Time-evolution of normalized crystallinity  $(X_c)$  determined from SAXS (solid circles), WAXS (open), and DSC (line) during isothermal crystallization at 100°C. The inset represents magnification on the early stage of crystallization.

Table 1Comparison of the onset times (sec) evaluated from DSC,<br/>SAXS, and WAXS data obtained at various crystallization<br/>temperatures  $T_C$ 

T <sub>C</sub>	100°C	101°C	102°C	103°C	104°C
DSC	$\sim 0$	_		-250	—
SAXS	$160\pm50$	$280\pm50$	$330\pm30$	$420\pm30$	$550\pm30$
WAXS	$160\pm50$	$460\pm60$	$570\pm100$	$700\pm50$	$1000\pm120$

に反射強度が一番強かった(110)ピークの積分強度 *I*<sub>110</sub> を 用い,以下の式で定義した。

$$X_{\rm C, WAXS} = I_{110} / (I_{110} + I_{\rm amor})$$
(3)

ここで、 $I_{amor}$ は非晶ハローのピーク面積である。ここで は $X_{C, WAXS}$ の値が結晶化度に比例するものと仮定した。 また、DSC から求まる規格化結晶化度もあわせて示した。 Fig. 6 はそれぞれから求めた最終の結晶化度の値で規格化 したものである。

SAXS, WAXS, DSC 測定から求めた規格化結晶化度が 増加し始める点(ベースラインからの背異点<sup>21)</sup>)に注目 する。この点を結晶化のOnset Time と呼ぶことにする。 Fig. 6 の挿入図(拡大図)からもわかるように100℃の等 温結晶化では SAXS と WAXS の結果はほぼ一致し, DSC はそれらに先立って変化が現れはじめた。種々の等温結晶 化温度で実験を行った結果(Table 1に示した),等温結晶 化温度が高温であればあるほど(平衡融点に近づくほど), Onset Time は増加し,更に SAXS と WAXS から求まる Onset Time の差が増大することがわかった。

また,高温ほど結晶化の駆動力が低下するためOnset Time が増加する(誘導期が長くなる)。Onset time の観 測手段の違いによる差異については、Hv-SALSの同時測 定も行い検討した。実験の詳細は割愛するが、100℃及び 103℃での測定により、Hv-SALS データに基づいて算出 した Onset Time (Hv-SALS の散乱強度が増大しはじめ る時間)は SAXS データに基づいて算出した Onset Time とほぼ一致した7,8)。結晶化にともなう変化が起こる順番 を時間順に並べると、DSC→SAXS/Hv-SALS(ほぼ同時) →WAXSとなっている。DSC が最も早く変化を示すの は、セグメントの凝集(発熱をともなうような変化)が局 所的に起こり、それが瞬時に達成されることにより、いち 早く DSC が発熱を検知できるからだと推測される。一方, WAXS による検知が最も遅いということは、SAXS で観 察される長距離密度ゆらぎや Hv-SALS で観察される配 向ゆらぎの発生よりも、WAXS で観察される微結晶の生 成の方が遅いことを示唆している。しかしながら、ここで 注意すべきことは、各測定で検出器の感度が異なっている こと、さらにはそれに加え、結晶化が起こりはじめている ことを各測定手法がどの程度敏感に捉えることができる か、という測定技法自身の感度の問題がある。結局のとこ ろ、観測手法の違いに関する上記の問題を解決しないと、 結晶化のごく初期段階で階層構造がどのように構築されは じめるか、あるいは誘導期で何が起こっているかを明らか にすることはできない。この問題を解決するためには、同 時測定に用いる種々の検出器の感度の違いを補正して、相 互に比較可能なようにデータを規格化する方法を確立する こと、さらには、各測定手法がいかなる状態変化を検知す るかを明確にする必要がある。例えば WAXS の場合,密 度ゆらぎを敏感に捉えそれを信号変化として検出できるの か、あるいは原子の規則的配列(結晶格子)が必須なの か、という問題である。また、信号を検出するための最低 限必要な状態変化の規模(検出限界)を明らかにすること も重要である。

アブラミ (Avrami) の式による解析の結果, アブラミ 指数は約3であることが明らかになった。103℃における 等温結晶化実験でも同様にアブラミ指数は約3であっ た。結晶化は本質的に不均一核形成と考えて差し支えない ので,アブラミ指数が3であることから,微結晶の成長 様式は3次元的であると結論される22)。すなわち、最終 的には球晶へと至る過程であるといえる。この結果は、溶 融状態でラメラ状ミクロ相分離構造を形成するブロック共 重合体の結晶化で得られた結果とも一致する<sup>23)</sup>。前述の 通り、ここで用いた試料はレオロジー測定により、105℃ 以下でラメラ状ミクロ相分離構造を形成することがわかっ ている。これは、結晶化により誘起されたものである。結 晶成長が3次元的であるということは、 ラメラ状ミクロ 相分離構造が結晶成長により乱される(歪曲あるいは分岐 する)ことを意味する。この様な結晶化によるミクロ相分 離構造のひずみは、結晶化温度がアモルファス成分である PEP のガラス転移温度よりはるかに高温であるため、当 然起こりうる。PEO-b-PB<sup>23)</sup>, PEO-b-PI<sup>24)</sup>系では,結晶 化によってラメラがかなり曲がりくねった,あるいは相互 に連結したような状態が透過型電子顕微鏡観察(TEM) により観察されている。我々が用いた PE-b-PEP 試料で も同様な構造が形成されているものと推測される。しかし ながら,結晶化後の SAXS プロフィールに4次に至るま で散乱ピークが明瞭に観測されている事実(Fig. 3)を考 慮すると,ホモポリマーの結晶化よりもずっと規則正しく ミクロなレベルの周期性を生み出しているわけである。も ちろん,それはブロック共重合体の自己凝集性によって規 定されているのである。

# 5. 結晶性ポリマーブレンドの高次構造形成 過程を追跡するための SAXS/WAXS/Hv -SALS 同時測定

結晶性ポリマーを一成分とするポリマーブレンドによっ て、その新規な階層性構造の構築が期待できる<sup>25,26)</sup>。本節 では、相分離したポリマーブレンド中で結晶化が起こる場 合の構造形成過程を SAXS/WAXS/Hv-SALS 同時測定に よって追跡した研究を紹介する<sup>9)</sup>。冒頭で述べたように、 結晶性ポリマーは階層性構造を形成することが知られてい る。高分子鎖は、通常規則的に折りたたまって厚みが均一 な結晶ラメラを形成し、さらにそれが放射状に成長し、球 晶となる。球晶は、大きいもので、数10 µm におよぶこと もある。結晶ラメラは光学異方性を有しているため、球晶 構造の解析は Hv-SALS 法によって行うことができる。

Fig.7は, KEK-PFのBL-15Aに設置したSAXS/WAXS/Hv-SALS同時測定装置の模式図である。最近はBL-9Cでおもにこの同時測定を行っている。測定試料の全く同じ位置に同時にX線とHe-Neレーザービームを入射させるため,X線とレーザービームを同軸にするように努力がなされた。そのため,X線は透過するがレーザービームは反射するようなミラーの開発が望まれたが,残念ながら成就せず,実際は通常のガラス製のミラーをX線経路を邪魔しないようにすれすれの位置に設置して,試料にレーザービームを入射した。このため,厳密には試料の同じ場所からの散乱が得られる訳ではないが,実際上問題にはならない程度の差である。

相分離したポリマーブレンド中での高分子の結晶化挙 動,特に球晶成長を考察するためのモデル系として,直鎖 状低密度ポリエチレン(LLDPE)/ゴムブレンドを試料と して用いた。LLDPE 試料は,炭素数8の分岐を有する (ダウケミカル:アフィニティ PL1880)。

一方、ゴム成分にはポリスチレン(PS)ブロック鎖と
 ポリエチレンブチレン(PEB)ブロック鎖からなる、トリブロック共重合体(SEBC)(JSR:ダイナロン4600P、
 ポリスチレンの重量分率 = 0.2)を用いた。LLDPEと
 SEBC を重量比で100/0, 80/20, 50/50となるように混合



Fig. 7 Schematic representation of simultanesous SAXS/WAXS/ Hv-SALS equipment installed at BL-15A beamline in Photon Factory of KEK.



Fig. 8 Two dimensional Hv-SALS patterns for the isothermal crystallization at 90.2°C, upon the quench after preheating of the sample at 180°C for 10 min. (a) LLDPE/SEBC = 80/20 and (b) 50/50 samples.

した。TEM 観察の結果, 50/50のブレンド試料は **Fig. 11** に模式的に示すような共連続な相分離構造を形成し, その 特徴的なサイズは約0.2~0.3 μm であることがわかってい る。

**Fig. 8**に等温結晶化温度  $T_{\rm C}$ =90.2℃で SAXS/WAXS/ Hv-SALS 同時測定して得られた 2 次元 Hv-SALS パター ンを示す。前述の Hv-SALS 光学系におけるミラー設置 の問題のため、パターンは下半分しか撮影できていない。 球晶構造からは、通常、四ツ葉のクローバーパターンが見 られるが<sup>27,28)</sup>, **Fig. 8**のようにふたつの葉しか撮影できて いないということである。しかしながら、下記の手順で球 晶半径を定量的に評価する際に、何ら支障はなかった。

温度ジャンプ直後では球晶に特徴的なクローバーパター ンは観察できなかったものの,どちらのブレンド試料につ いても,やがてクローバーパターンが出現してくるのが確 認できた。LLDPE/SEBC=80/20ブレンド試料と50/50ブ レンド試料(40分後あるいは60分後の定常状態)の散乱 像を比較するとLLDPE/SEBC=50/50ブレンド試料のほ うがクローバーパターンが小さい,つまり大きい球晶が存 在していることがわかる。

Hv-SALS 測定結果を定量的に解析するために, CCD カメラで撮影した 2 次元 Hv-SALS パターン画像をコン ピュータに取り込み, グレースケール化して, 輝度を 0~ 255で数値化した。そののち, パターンの方位角 $\mu$ =225° ±20°(または方位角 $\mu$ =135°±20°)の範囲内で散乱強度 を平均(扇形平均)してI(q)を求めた。なお, 方位角は **Fig. 8**に示すように子午線上向を $\mu$ =0°として,時計回り に定義した。このようにして得られた散乱プロフィールの ピーク位置( $q_m$ )から次式によって球晶半径  $R_s$ を求める ことができる<sup>27,28</sup>。

$$R_{\rm S} = 4.09/q_{\rm m}$$
 (4)

 $q_{\rm m} = (4\pi/\lambda) \, \sin \theta_{\rm m} \tag{5}$ 

ここでλは試料中でのレーザー光の波長, θ<sub>m</sub>は散乱プロ フィールのピーク位置を与える散乱角の半分の値(すなわ ち, θ<sub>m</sub>の2倍が散乱角。試料中での値)である。前述し たように、球晶は最上位の階層に位置する構造であり、通 常,サブミクロンから数ミクロンのサイズである。Fig.1 に示したように, 球晶は, 結晶ラメラが放射状に成長する ことによって形成される。結晶ラメラは結晶軸方向によっ て屈折率が異なるため、光学異方性を有する。球晶内部で 結晶ラメラが放射状に分布しているので、その光学主軸が 回転対称的に分布することになる。Hv-SALS では屈折率 のゆらぎに起因する散乱を検出するので、光学主軸がポー ラライザーあるいはアナライザーに平行な場合は散乱が全 く検出されず,暗くなる。一方,それらに対して45°の方 位で最も明るく散乱が検出される。本研究で用いたポリエ チレンが形成する球晶では、ポーラライザーあるいはアナ ライザーに平行な方位が消光位,それらに対して45°の方 位で散乱光が最大になる。また、球状の物体による形状散 乱因子により,干渉性の散乱極大が現れる。これら2つ の要因により、散乱極大が方位角45°方向に4か所出現す るため、四ツ葉のクロバーパターンが観察されることにな る。そのような理由ゆえ、干渉性の散乱極大位置 qm から (4)式の関係を用いて球晶の半径を求めることができる。

求まった *R*<sub>s</sub>の時間発展を Fig. 9 に示す。球晶半径は大 きいものでも 5 μm 程度であり,球晶の直径としては10 μm 以下であるので,光学顕微鏡で観察可能な限界ぎりぎ りである。50/50ブレンド試料を除き,*R*<sub>s</sub> はほとんど時間 変化せずほぼ一定であった。つまり,球晶は形成当初から 一定の大きさで,その後,サイズがほとんど変わらないと いうことを示している。発生当初は小さく,その後成長す るという常識から考えると大変意外な結果であった。ま



Fig. 9 Time course of the radius of spherulite for the isothermal crystallization at 90.2°C, upon the quench after preheating of the sample at 180°C for 10 min.



Fig. 10 Time course of apparent degree of crystallinity  $(X_C)$ , long period of crystalline lamellae, and  $Q_{SAXS}$  for the isothermal crystallization at 90.2°C, upon the quench after preheating of the sample at 180°C for 10 min. (a) LLDPE/SEBC=80/20 and (b) 50/50 samples.

た,50/50ブレンド試料では80/20ブレンド試料より,さ らにはホモポリマー試料よりも球晶は大きくなった。ブレ ンド中では共連続な相分離構造が形成されており,結晶ポ リマー(LLDPE)相のサイズは約0.2~0.3 µm である。 このような狭い空間では,球晶は大きく成長することがで きないと予想されるが,上記の結果はこの予想と全く逆で ある。理由は充分解明されていないが,おそらく, LLDPE 組成の減少とともに,形成される球晶数が減少 し,かつ,既存の相分離構造によって成長が阻害される球 晶数が増加し,生き残って最後まで成長を遂げた球晶の個 数が減少するためと思われる。その結果,最後まで成長を 遂げた球晶はかなり大きくなるというわけである。

**Fig. 10**は, 等温結晶化温度 *T*<sub>C</sub>=90.2℃で SAXS/WAXS /Hv-SALS 同時測定して得られた SAXS と WAXS の結

果をまとめたものである。SAXS データからインバリア ント  $Q_{SAXS}$ を求める方法は、前節で述べた通りである ((2)式))。ただし、実際の積分範囲は $0.1 \le q \le 0.5 \text{ nm}^{-1}$ とした。

WAXS データからみかけの結晶化度 *X*c を求める方法 は(3)式とは少し異なり,

$$X_{\rm C} = (I_{110} + I_{200}) / (I_{110} + I_{200} + I_{\rm amor})$$
(6)

とした。ここで  $I_{110}$  及び  $I_{200}$  は各々(110) 面及び(200) 面 からの反射ピーク面積(積分強度),  $I_{amor}$  は非晶ハローの ピーク面積である。各ピーク面積は1次元 WAXS プロフ ィールをピーク分離して算出した。また,長周期(long period) とは,アモルファス相を挟んで周期的に繰り返す 結晶ラメラの平均間隔である。SAXS 散乱強度 I(q) に散 乱ベクトル q の 2 乗をかけてローレンツ補正したもの  $[q^2$ I(q)] を散乱ベクトルの大きさ q に対してプロットすると q=0.2 nm<sup>-1</sup> 付近に結晶ラメラの長周期に起因するピーク が現れ,そのピーク位置の値  $q_m$  から

$$L = 2\pi/q_{\rm m} \tag{7}$$

によって長周期Lを算出した。

結晶ラメラの長周期は SEBC の組成や時間経過に関係 なくほぼ一定の値, 29~32 nm であった。ただし, 80/20 ブレンド試料において, 等温結晶化初期では結晶ラメラの 長周期が少し大きく, 時間が経過するにつれてわずかに減 少しやがて一定の値となった。同様の現象は Zachmann ら<sup>29)</sup>や Hsiao ら<sup>30,31)</sup>によっても報告されている。この理由 として, あらたに周期の短い結晶ラメラが形成し, 既に存 在している長い周期の結晶ラメラと混在するために平均化 されて, 見かけ上, 周期が短く見えるということも考えら れるかもしれないが, Zachmann らの説明によると, 既に 存在する結晶ラメラ繰り返し構造の非晶領域中に新しく結 晶ラメラが割り込むように形成することによって, 結果的 に平均のラメラ繰り返し周期が減少するためであるとされ ている。

相分離構造の特徴的なサイズ(約0.2~0.3 $\mu$ m)と比較 すると、結晶ラメラの長周期は十分小さく、相分離構造が 結晶ラメラの成長を阻害する要因ではないことがわかる。 見かけの結晶化度  $X_c$ はすべての試料で時間とともに増大 したが、最終的に得られる見かけの結晶化度  $X_c$ は SEBC の組成が増加するにつれて低下した。結晶相(LLDPE 相) の体積分率が減少する分を割り引いて考慮しても、SEBC の組成が増加するにつれて結晶化度が低下する傾向に変わ りはないことがわかった。すなわち SEBC 相による結晶 化の阻害作用が最終的な結晶化度も低下させたといえる。 また、Fig. 10 において結晶ラメラの長周期が時間変化して いないにもかかわらず、インバリアント  $Q_{SAXS}$ と見かけ



**Fig. 11** Schematic representation for a possible mechanism of spherulite growth in a phase-separated polymer blend.

の結晶化度 Xc が増加している。2次結晶化が起こってい ることが示唆されるが,結晶ラメラ間の非晶領域内に新た に結晶ラメラが割り込むように形成されると,結晶ラメラ の長周期は減少するはずである。しかしながら,結果はそ うなっていないことから,2次結晶化によって結晶相が厚 くなったと推測される。

前節と同様に,各測定結果からOnset Time を求めて比較したところ,ほとんど有為差は見られなかったが,あえて言うと,結晶化にともなう変化が起こる順番は,前節の結果と同様,時間順にSAXS/Hv-SALS(ほぼ同時)→WAXSという傾向であることがわかった。DSC測定はこの系については行っていない。前節でも述べたように,各測定の検出器の感度が異なっていること,結晶化が起こりはじめていることを各測定手法がどの程度敏感に捉えることができるか,という測定技法自身の感度の問題があるため,相対的な大小関係の妥当性については解釈が難しく,現在のところ明確な説明は得られていない。

次にブレンド組成の違いによる影響を考察する。ゴム成 分の増加とともに, Onset Time は増大した。すなわち結 晶化の誘導期が長くなることがわかった。特に,LLDPE/ SEBC = 50/50の試料では,LLDPE ホモポリマーの誘導 期よりも2倍以上長くなっていた。また,ここには示し ていないが、結晶化温度87.2℃において等温結晶化実験も 行った。その結果,最終的な結晶化度は87.2℃,90.2℃と もほぼ等しく、異なる等温結晶化温度でも時間発展の傾向 が似ていることがわかった。球晶成長のメカニズムも87.2 ℃,90.2℃ともに同様であると推測できる。そこで,これ らの結果に基づき、球晶成長のメカニズムを考察すると Fig. 11に模式的に示すように、結晶ラメラが相分離した LLDPE 相をたどって放射状に成長できると推測される。 結晶ラメラの放射状の成長は球晶成長の初期段階であるの で、結果的に相分離構造よりもずっと大きく球晶が成長で きたと推測される。また、ゴム成分の増加とともに LLDPE 相内での結晶成長が遅く、初期段階から後期段階 に至るまで結晶成長が相分離構造(拘束空間)によって阻 害されることもわかったので、これはつまり、ホモポリ マーよりもブレンド試料のほうが球晶にまで成長を遂げる 核数は少ないことを示唆する。成長を阻害されなかった核 が大きく成長するため、その結果ブレンド試料中のほうが ホモポリマー中よりも球晶が大きくなったこと(**Fig. 9**) も推測できる。

## 6. おわりに

ここでは、放射光(KEK-PFのBL-9CとBL-15A)を 利用した結晶性ブロック共重合体 PE-PEP の等温結晶化 における SAXS/WAXS/DSC 同時測定による構造形成過 程の観察、相分離したポリマーブレンド中での球晶成長の メカニズムを考察するための LLDPE/SEBC ブレンド試 料を用いた SAXS/WAXS/Hv-SALS 同時測定による等温 結晶化実験について紹介した。同時測定により,熱履歴, 実験条件やサンプルの個体差などの問題は解消されるた め,高分子の結晶化挙動,とくに球晶成長についてより建 設的な考察を行うことができた。しかしながら、各測定で 検出器の感度が異なっていること, さらにはそれに加え, 結晶化が起こりはじめていることを各測定手法がどの程度 敏感に捉えることができるか、という測定技法自身の感度 の問題がある。これらの問題を解決するためには、同時測 定に用いる種々の検出器の感度の違いを補正して、相互に 比較可能なようにデータを規格化する方法を確立するこ と、さらには、各測定手法がいかなる状態変化を検知する かを明確にする必要がある。例えば WAXS の場合, 密度 ゆらぎを敏感に捉えそれを信号変化として検出できるの か,あるいは原子の規則的配列(結晶格子)が必須なのか, という問題である。また、信号を検出するための最低限必

要な状態変化の規模(検出限界)を明らかにすることも重要である。

このように,未解決な問題点はまだ残ってはいるもの の,同時測定の意義は非常に高く,本稿が様々な同時測定 法を企画実施される際の一助になれば幸いである。

#### 謝辞

本稿は、高エネルギー加速器研究機構の放射光科学研究 施設のBL-9CならびにBL-15Aにおいて遂行した共同利 用実験(課題番号2001G269,2001G275,2003G275)の成 果をまとめたものである。結晶性のブロック共重合体試料 を提供頂いた,北九州市立大学国際環境学部の秋葉勇助教 授に感謝申し上げる。また、測定では広島大学大学院生物 圏科学研究科の上野聡助教授,群馬大学工学部の高橋浩助 教授,名古屋工業大学大学院工学研究科の岡本茂助教授に ご協力を賜った。ここに深く感謝申し上げる。

#### 参考文献

- 1) B. Chu and B. S. Hsiao: Chem. Rev. 101, 1727 (2001).
- F. S. Bates, K. A. Koppi, M. Tirrell, K. Almdal and K. Mortensen: Macromolecules 27, 5934 (1994).
- S. Okamoto, K. Saijo and T. Hashimoto: Macromolecules 27, 3753 (1994); *ibid* 27, 5547 (1994).

- W. Bras, G. E. Derbyshire, D. Bogg, J. Cooke, M. J. A. Elwell, B. E. Komanschek, S. Naylor and A. J. Ryan: Science 267 (5200), 996 (1995).
- K. Tashiro, S. Kariyo, A. Nishimori, T. Fujii, S. Saragai, S. Nakamoto, T. Kawaguchi, A. Matsumoto and O. J. Rangsiman: J. Polym. Sci. Part B Polym. Phys. 40, 495 (2002).
- S. Rastogi, J. G. P. Goossens and P. J. Lemstra: Macromolecules 31, 2983 (1998).
- S. Okamoto, K. Yamamoto, K. Nomura, S. Hara, I. Akiba, K. Sakurai, A. Koyama, M. Nomura and S. Sakurai: J. Macromol. Sci. Part B Phys. 43, 279 (2004).
- S. Sakurai, S. Okamoto and K. Sakurai: in "Developments in Block Copolymer Science and Technology", ed. by I. W. Hamley, John Wiley & Sons, London, Chapter 4, p. 127 (2004).
- 9) 林 京子,江島靖和,清水武史,木崎寿美子,原 滋郎, 山本勝宏,岡本 茂,櫻井伸一:日本レオロジー学会誌 32,179 (2004).
- 10) http://pfwww.kek.jp/nomura/hx/9c/bl9c.html
- K.-N. Kruger and H. G. Zachmann: Macromolecules 26, 5205 (1993).
- 12) W. J. O'Kane, R. J. Young, A. J. Ryan and W. Bras: Polymer 35, 1352 (1994).
- 13) M. Kellens, M. Meeussen, R. Gehrke and H. Reynaers: Chem. Phys. Lipids 58, 131 (1991).
- T. Russell and J. T. Koberstein: J. Polym. Sci. Polym. Phys. Edit. 23, 1109 (1985).
- W. Bras, G. E. Derbyshire, A. Devine, S. M. Clark, J. Cooke, B. E. Komanschek, S. Naylor and A. J. Ryan: J. Appl. Cryst. 28, 26 (1995).
- 16) G. Ungar and J. L. Feijoo: Mol. Cryst. Liq. Cryst. 180B, 281 (1990).
- 17) S. Abe and H. Takahashi: J. Appl. Cryst. 36, 515 (2003).
- 18) H. Takahashi, S. Ueno and C. Katagiri: J. Appl. Cryst. 36, 545 (2003).
- 19) G. Strobl: "The Physics of Polymers", Springer (1997).
- 20) Ian W. Hamley: "ソフトマター入門―高分子・コロイド・ 両親媒性分子・液晶"好村ら訳,シュプリンガー・フェア ラーク東京(2002): correlation hole は,「相関空孔」と訳 されている。A 鎖と B 鎖からなるブロック共重合体が無秩 序状態で形成する濃度ゆらぎは,A 鎖と B 鎖が化学結合さ れているがゆえに,長距離にまでは至らず,有限の範囲内 に限定される。その範囲はおよそブロック共重合体1分子 鎖が占める広がり程度である。したがって,高分子鎖の回 転半径程度の距離で濃度ゆらぎの相関が最も強くなる。こ れに対応して,散乱関数にピークが現れる。
- 21) R. J. Terrill, P. A. Faiclouge, E. Towns-Andrews, B. U. Komanschek and R. J. Ryan: Polymer 39, 2381 (1998).
- 22) J. M. Schultz: "Polymer Crystallization-The Development of Crystalline Order in Thermoplastic Polymers", Oxford Univ. Press (2001).
- 23) H. Chen., J. Wu, T. Lin and J. Lin: Macromolecules 34, 6963 (2001).
- 24) H. Schnablegger, D. H. Rein and R. E. Cohen: J. Polym. Eng. 16, 1 (1996).
- N. Inaba, K. Sato, S. Suzuki and T. Hashimoto: Macromolecules 19, 1690 (1986).
- N. Inaba, T. Yamada, S. Suzuki and T. Hashimoto: Macromolecules 21, 407 (1988).
- 27) R. S. Stein and M. B. Rhodes: J. Appl. Phys. 31, 1873 (1960).
- 28) R. S. Stein and P. R. Wilson: J. Appl. Phys. 33, 1914 (1962).
- 29) H. Z. Zachamann and C. Wutz: "Crystallization of polymers", ed by M. Dosiere, Kluwer Academic, New York, 403 (1993).

● 著 者 紹 介 ●

- 30) Z. G. Wang, B. S. Hsiao, E. B. Sirota and S. Srinivas: Polymer 41, 882 (2000).
- 31) Z. G. Wang, B. S. Hsiao, E. B. Sirota, P. Agarwal and S. Srinivas: Macromolesules 33, 978 (2000).
- 32) 橋本雅人:京都工芸繊維大学平成12年度公開講座「姿形・

変化(かたち・へんげ)高分子と繊維の美と不思議―若き 潮流の VISUALIZATION―」テキスト,4ページ;「橋本 雅人のホームページ」http://senzai07.poly.kit.ac.jp/study/ kouji.jpg



山本勝宏 名古屋工業大学大学院工学研究科・助手 〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町 E-mail: yamamoto.katsuhiro@nitech.ac.jp 専門:高分子構造・物性 [略歴]

1999年名古屋工業大学大学院博士後期 課程修了,1998年日本学術振興会特別 研究員,1999年より現職。



櫻井伸一

京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科 • 助教授 〒606-8585 京都市左京区松ヶ崎御所 海道町 E-mail: shin@kit.jp

専門:高分子物理,小角 X 線散乱 [略歴]

1989年京都大学大学院工学研究科博士 後期課程単位認定退学,1989年京都工 芸繊維大学繊維学部助手,1998年京都 工芸繊維大学繊維学部助教授,2006年 より現職。

# Formation process of hierarchical structures in crystalline polymers as analyzed by simultaneous measurements of small-angle X-ray scattering and other techniques

Katsuhiro YAMAMOTODepartment of Materials Science & Technology<br/>Graduate School of Engineering, Nagoya Institute of Technology,<br/>Gokiso-cho, Showa-ku, Nagoya 466–8555Shinichi SAKURAIDepartment of Macromolecular Science & Engineering<br/>Graduate School of Engineering, Kyoto Institute of Technology,<br/>Matsugasaki, Sakyo-ku, Kyoto 606–8585

**Abstract** Crystalline polymers spontaneously form hierarchical structures, which provide us a potential use as a specialty material. Recently, not only a crystalline homopolymer but also semi-crystalline block copolymers and crystalline polymer blends have been attracting interests for the study of a hierarchical structure. In order to analyze such hierarchical structures in a variety of length scales, a simultaneous measurement of small-(SAXS) and wide-angle (WAXS) X-ray scattering with differential scanning calorimetry (DSC), or with small-angle light scattering (Hv–SALS) are most suitable. In this review, we show some examples of the simultaneous measurements. With DSC, exothermic heat flow can be simultaneously measured with X-ray scattering. On the other hand, with Hv–SALS it is possible to analyze evolution of a spherulitic structure, which is the structure at the highest rank in the hierarchy. For both cases, one can realize that it is impossible to obtain good statistics for SAXS and WAXS measurements without synchrotron radiations.